

Instituto Superior Técnico

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Sistemas Integrados Analógicos Projecto de Alto Nível de um ADC e DAC

Maria Margarida Dias dos Reis n.º 73099 Nuno Miguel Rodrigues Machado n.º 74236

${\rm \acute{I}ndice}$

1	Intr	rodução	1
2	Introdução Teórica		1
	2.1	Conversores A/D e Conversores D/A	1
	2.2	SINAD, SNR, SFDR e ENOB	2
	2.3	Janela Rectangular, Janela de Hamming e Janela de Blackman-Harris	3
3	Der	nonstração de Resultados	4
•	3.1	Análise de uma onda sinusoidal com frequência de amostragem de 1 Mhz	1
	_	•	
	3.2	Análise de uma onda sinusoidal com frequência de amostragem de 1.1 Mhz	- 5

1 Introdução

Com este trabalho laboratorial pretende-se introduzir o *software* Cadence, projectando um conversor AD/DA de alto nível. Analisando os conversores analógico-digitais (ADC) pode-se melhor compreender o conceito de *Fast Fourier Transform* (FFT), e a maneira como pode ser aplicada para medir parâmetros dos ADC, como a SINAD e o ENOB. Pretende-se também estudar o efeito de aplicar diversas janelas sobre a FFT.

2 Introdução Teórica

2.1 Conversores A/D e Conversores D/A

Começando por analisar os conversores analógico-digitais, as arquitecturas que os permitem podem ser divididas em três categorias: baixa-a-média velocidade, média velocidade e alta velocidade. O ADC utilizado neste trabalho é de aproximações sucessivas (SAR), sendo de média velocidade e exactidão.

Os conversores deste tipo estão entre os mais populares para realizar ADCs devido à sua versatilidade - conseguem efectuar conversões rápidas ou podem ser utilizados para que haja uma maior exactidão, operando a baixa potência nos dois casos. Este conjunto de características deriva de, no caso mais simples, o conversor necessitar apenas de um só comparador, um banco de condensadores com interruptores e pouca lógica de controlo digital. Na figura abaixo está esquematizado o circuito referido.

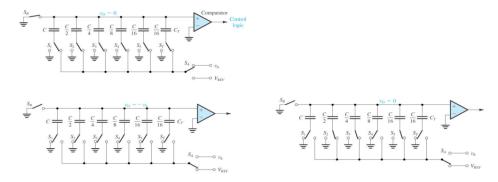


Figura 1: ADC construído com uma arquitectura de aproximações sucessivas.

O diagrama de blocos de um ADC unipolar de aproximações sucessivas que utiliza também um DAC é apresentado de seguida.

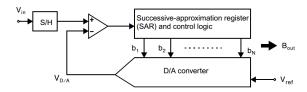


Figura 2: Diagrama de blocos de um ADC de aproximações sucessivas.

OS ADCs de aproximações sucessivas têm por base o algoritmo de procura conhecido como "procura binária", onde os dados podem ser calculados em N passos, para um conjunto de dados organizados de tamanho 2^N .

Existe um circuito sample-and-hold que permite adquirir a tensão de entrada. De seguida um comparador analógico de tensão compara a tensão de entrada com a saída do DAC e coloca o resultado da comparação no registo de aproximações sucessivas (SAR). O SAR é inicializado de maneira a que o bit mais significativo seja 1. Este código é dado ao DAC, que fornece então ao comparador uma tensão analógica equivalente à do código digital. O circuito comparador é assim capaz de efectuar a comparação entre a tensão de entrada amostrada e a tensão de referência. Se a tensão de referência for superior à tensão de entrada então é feito reset ao bit, passa a 0, caso contrário permanece a 1.

De seguida, o próximo bit é colocado a 1 e feito o mesmo teste, continuando esta "procura binária" até que todos os bits tenham sido testados no SAR. Assim, o conversor aplica o algoritmo para determinar a palavra digital mais próxima que corresponde à tensão de entrada amostrada.

2.2 SINAD, SNR, SFDR e ENOB

O signal-to-noise and distortion (SINAD) é uma medida da perfomance dinâmica geral de um ADC. É o rácio entre a amplitude do sinal em root-mean-square (valor eficaz) e o valor médio da root-sum-square das restantes componentes espectrais, incluindo harmónicas, mas excluindo a componente DC. O cálculo do SINAD em dB é feito de acordo com a expressão

SINAD =
$$10 \times \log_{10} \left(\frac{A_{\text{bin}(f_{in})}^2}{\sum_{n=2}^{\text{size/2}} \left(A_n^2 - A_{\text{bin}(f_{in})}^2 \right)} \right)$$
 (2.1)

O signal-to-noise ratio (SNR) é calculado a partir dos dados da FFT, tal como a SINAD, mas as harmónicas do sinal são excluídas dos cálculos, deixando apenas os termos de ruído. De uma maneira mais abstracta pode ser descrito como a comparação entre o nível de sinal desejado ao nível de ruído. O cálculo do SNR, em dB, para um número N de amostras é feito de acordo com a expressão

$$SNR = 6,02N + 1,76. (2.2)$$

A spurious free dynamic range (SFDR) é o rácio entre a amplitude máxima do sinal a amplitude máxima seguinte, ou seja, é a diferença entre as duas amplitudes máximas. À semelhança da SINAD não inclui a componente DC. O cálculo da SFDR em dB é feito de acordo com a expressão

$$SFDR = 10 \times \log_{10} \left(\frac{A_{\text{bin}(f_{in})}^2}{A_{\text{bin}_{\text{max}}(\neq f_{in})}^2} \right). \tag{2.3}$$

O effective number of bits (ENOB) é uma medida da resolução de um ADC. De facto, a resolução de um ADC é dada pelo número de bits que são utilizados para representar um valor analógico porém, todos os ADCs reais introduzem ruído e distorção. Assim, o ENOB especifica o número

efectivo de bits que se tem na realidade, quando se considera a existência de ruído. O cálculo do ENOB é feito de acordo com a expressão

ENOB =
$$\frac{\text{SINAD} - 1,76}{6,02}$$
. (2.4)

No caso do trabalho laboratorial o ENOB é de 4 bits.

2.3 Janela Rectangular, Janela de Hamming e Janela de Blackman-Harris

A FFT é um algoritmo que permite obter a *Discrete Fourier Transform* (DFT), sendo então uma análise que permite converter tempo para frequência. Quando se calcula a DFT a entrada é um sinal digital e a saída é a análise digital espectral desse sinal. Inerentes à DFT estão erros e, para mitigar esses erros, recorre-se a um processo denominado de *windowing*.

A análise espectral da DFT depende de uma determinada frequência de amostragem, f_s , e, consequentemente, toda essa análise estará entre 0 e metade de f_s . Assim, a largura de banda da DFT é proporcional ao ritmo de amostragem. Este período de amostragem é dado por

$$\Delta t = \frac{1}{f_s},\tag{2.5}$$

sendo que no domínio da frequência existem os chamados bins. A frequência de um determinado bin k relaciona-se com a frequência do sinal de entrada de acordo com

$$f_k = \frac{k}{N \triangle t},\tag{2.6}$$

onde k corresponde ao número do bin, que é sempre um inteiro, e N ao número de amostras. Através de 2.6 pode-se deduzir qual é a máxima frequência que pode ser representada por um dado número de amostras.

$$k = \frac{Nf_k}{f_s}. (2.7)$$

Analise-se agora o caso do trabalho laboratorial, em que a onda de entrada tem uma frequência de 13,671875 kHz, a frequência de amostragem é de 1 MHz e são utilizadas 512 amostras. Espera-se que o máximo da amplitude ocorra em k = 7.

Ainda para o mesmo sinal de entrada, quando a frequência de amostragem passa para 1,1 MHz, espera-se que o máximo de amplitude ocorra em k=6,36364. Este valor não é inteiro e cada bin corresponde a uma frequência e não a um intervalo de frequências. Assim sendo, a DFT não consegue representar energia em k=6,36364 pelo que a energia tem uma leak entre os bins k=6 e k=7, fenómeno conhecido como spectral leakage.

Para procurar resolver este problema de *spectral leakage* existe *windowing*. Com esse processo é possível concentrar a energia nos *bins* que têm maior amplitude (os que estão próximos do *bin* de amplitude máxima) e atenuar a energia dos *bins* circundantes.

O windowing é implementado multiplicando o sinal de entrada por uma função de janela. Existem diversas funções de janelas, considerando-se aqui a janela rectangular, a janela de Hamming e a janela de Blackman-Harris.

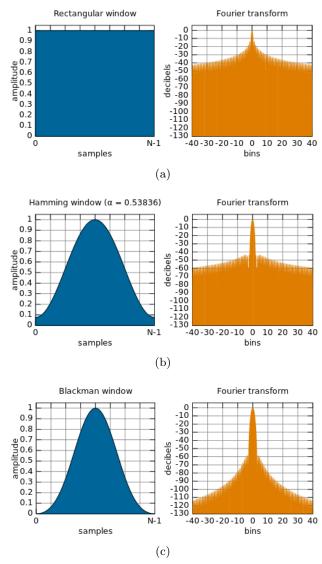


Figura 3: Magnitude (azul) e representação gráfica da DFT (laranja) da janela rectangular (a), magnitude (azul) e representação gráfica da DFT (laranja) da janela de Hamming (b) e magnitude (azul) e representação gráfica da DFT (laranja) da janela de Blackman-Harris (c).

3 Demonstração de Resultados

3.1 Análise de uma onda sinusoidal com frequência de amostragem de 1 Mhz

Na análise presente verificou-se a coerença entre a frequência do sinal de entrada e a frequência de amostragem, podendo dispensar-se o uso do processo windowing, na FFT implementada. Como já foi referido é necessário cumprir as seguintes exigências:

k tem que ser um número inteiro, com a frequência $f_k = f_{in} = 13,671875$ kHz. Usando a equação anterior (2.7), aplica-se uma frequência de amostragem de 1 MHz e um número de amostras igual 512. Concluido que k = 7 onde se espera uma máximo de amplitude.

Para que a FFT consiga reporduzir o sinal correctamente sem distorção apartir das amostras obtidas é necessário que o k seja um número inteiro, e que a frequência de amostragem da FFT seja

igual à frequência de amostragem do ADC. Como foi escolhido usar 512 amostras, e sabesse que a frequência de amostragem do ADC é de 1MHz, logo para que a FFT tenha a mesma frequência de amostragem, aplicando a equação seguinte (3.1) obteve-se uma janela temporal, $t_{wind} = 512\mu$ s.

$$t_{wind} = \frac{N}{f_s}. (3.1)$$

3.2 Análise de uma onda sinusoidal com frequência de amostragem de 1.1 Mhz

Mantendo a mesma frequência de entrada, 13,671875kHz, e alterando a frequência de amostragem para 1.1MHz verifica-se a não coerença entre as duas frequências. Sendo necessário o uso do processo windowing.

Seguindo os passos da análise anterior, utilizou-se a equação (2.5) de forma a obter o valor de k usando uma frequência $f_k = f_{in} = 13,671875$ kHz, uma frequência de amostragem de 1.1MHz e um número de amostras igual a 512. Obteve-se um k = 6.36364, confirmando a não coerença e a ocorrência de spectralleakage.

Para que a FFT consiga representar correctamente o sinal pretendido , é necessário defenir um tamanho da janela correcto. Como já foi referido a frequência de amostragem da FFT tem que ser igual à frequência de amostragem do sinal de entrada, ou seja de 1,1MHze um número de amostras igual a 512. Assim sendo, usando a equação (3.1), obteve-se uma janela temporal, $t_{wind} = 465, 455 \mu s$.